

**О НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ *p*-ПОДСИСТЕМЫ
АНИОНОВ CuO₂-ПЛОСКОСТЕЙ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКАХ**

И.И.Амелин

Мордовский государственный университет

430000 Саранск, Россия

Поступила в редакцию 14 апреля 1999 г.

После переработки 20 мая 1999 г.

В приближении CNDO выполнены расчеты электронной структуры кластера кристалла YBa₂Cu₃O₇. Установлено, что гибридизированная *d*-*p*-зона плоскостей состоит из почти заполненной *d*-подзоны шириной 3 эВ и незаполненной *p*-подзоны шириной 0.8 эВ. Рассчитанная структура зоны удовлетворительно согласуется с экспериментальными исследованиями. Показано выполнение в плоскостях неравенства Шубина – Вонсовского. Данные условия являются причиной образования в *p*-подсистеме волны зарядовой плотности. В этом приближении энергия образования локальных пар оценивается величиной *kT**.

PACS: 74.20.Kk, 74.80.Dm

В 1934 г. Шубин и Вонсовский показали [1], что в узкой половине заполненной металлической зоны с одним электроном на центр при выполнении условия

$$ZV > I, \quad (1)$$

где *Z* – число ближайших соседей, *I* – энергия электростатического взаимодействия двух коллективизированных (бывших валентных) электронов у одного узла кристаллической решетки и такая же энергия между двумя коллективизированными электронами *V* двух соседних узлов решетки, возникает полярное состояние (именуемое в литературе как состояние с волной зарядовой плотности (ВЗП)) с параметром порядка *m* = 2. Параметр *m* равен разности электронной плотности на соседних центрах. Значение *m* = 2 соответствует образованию в системе локальных электронных пар. Последующие исследования установили [2], что состояние с ВЗП в узких зонах является диэлектрическим и характеризуется запрещенной зоной $\Delta E = (ZV - I)m$. В обычных металлах условие (1) выполняется при межцентровых расстояниях $r_0 \leq 1 \div 2 \text{ \AA}$. Но, как показано в [3], при таких *r*₀ диэлектрическое состояние не реализуется из-за наличия широкой зоны (большой кинетической энергии носителей). Однако условие (1) будет реализовано при больших *r*₀ (случай узких зон) вследствие уменьшения параметра *I*. При уширении зоны происходит резкое уменьшение параметров *m* и ΔE [3].

Кластерные расчеты кристалла YBa₂Cu₃O_{6+δ} методом CNDO установили [4], что в плоскостях, выделенных в отдельную квантовую подсистему, *p*-подсистема нестабильна и в ней образуется ВЗП. Было сделано предположение [4], что причиной нестабильности является выполнение условия (1) в узкой *p*-подзоне плоскостей. В настоящей работе для подтверждения этого предположения выполнены оценки параметров *V*, а также расчет плотности электронных состояний *N(E)* плоскостей кластера кристалла YBa₂Cu₃O₇.

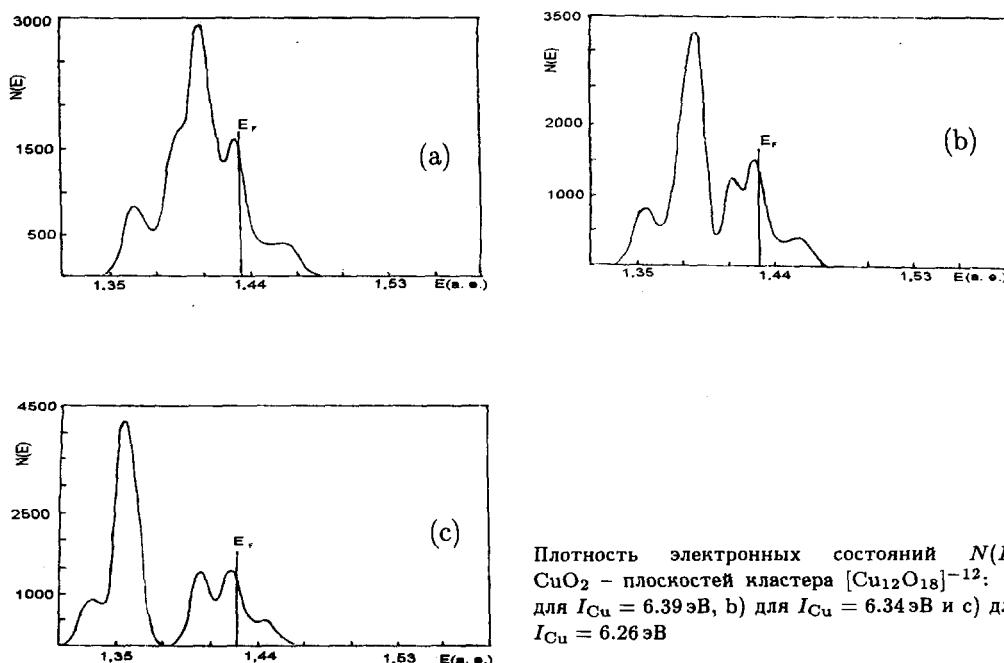
Анализируя результаты рентгеновской эмиссионной и рентгенэлектронной спектроскопии, а также зонные расчеты, в [5] делается вывод о том, что в $\text{La}_{1.83}\text{Sr}_{0.17}\text{CuO}_4$ с температурой $T_c = 40 \text{ K}$ вклад d -состояний превалирует в высокогенеретической части зоны вблизи уровня Ферми. В $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ с температурой $T_c = 92 \text{ K}$, наоборот, d -состояния сосредоточены в основном в низкогенеретической области, а вблизи уровня Ферми преобладают $2p$ -состояния. Результаты расчета зоны показывают, что в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ наблюдается сильная гибридизация с $3d$ -состояниями и расщепление плотности $2p$ -состояний на две подполосы. Это объясняется тем, что в данной структуре каждый из атомов кислорода связан с двумя атомами меди.

В [6] отмечается, что разница энергий электронных состояний ионов Cu^{+2} и O^{-2} весьма мала по сравнению с другими парами $M^{+2}-\text{O}^{-2}$. Поэтому при изменении положения иона O_2^- , находящегося в соединении $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ над ионом Си, происходит значительное перетекание заряда в плоскости между ионами Си и О. Результаты о перетекании заряда были также подтверждены в [7,8]. Аналогичный результат должен наблюдаваться и в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+\delta}$ при допировании. Кроме этого, допирование кислородом вызовет в кристалле незначительную экранировку параметра I_{Cu} . Установлено, что переход антиферромагнитный диэлектрик (АФД) – металл при увеличении δ связан с образованием дырок на анионах кислорода в плоскостях [9]. С помощью фотоэлектронных спектров тонких пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ установлено повышение плотности d -состояний меди и уменьшение плотности p -состояний кислорода около уровня Ферми по сравнению с пленками $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ [10]. Таким образом, экспериментальные данные указывают на то, что при допировании в плоскостях кислород стремится к необычной степени окисления O^{-1} , а ионы меди – к конфигурации Cu^{+1} .

В [1] определена структура $3d$ -зоны меди пленки $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ при двух температурах (300 и 80 К). Обнаружено сужение $3d$ -зоны и уменьшение эффективного потенциала отталкивания дырок для меди при низкой температуре. При 80 К в плотности состояний имеется узкий пик шириной менее 1 эВ и наплыv, удаленный от узкого пика на 2 эВ. Таким образом, ширина $3d$ -зоны кристалла оценивается величиной порядка 3 эВ. Кривая плотности состояний в этом случае близка к плотности состояний чистой меди, полученной методом фотоэлектронной спектроскопии, у которой $3d$ -зона локализована. Наличие уширения зоны при 300 К свидетельствует о достаточно сильном перекрытии Си–О-орбиталей, приводящем к делокализации $3d$ -электронов. Авторы [11] обнаруженное сужение $3d$ -зоны с понижением T связывают со структурными искажениями плоскости CuO_2 , где происходят смещения атомов кислорода. По-видимому, в этом случае данное явление должно наблюдаться во всех высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), но экспериментальные исследования показывают, что этот эффект наблюдается только в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. С нашей точки зрения [4], увеличение ширины $d-p$ -зоны плоскостей $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ с 3 эВ [12] до 9 эВ (рассчитанное значение $d - p$ -зоны кристалла, представляющей единую квантовую систему [13]) связано с возникновением химической связи между плоскостями и цепочками, перекачкой электронной плотности с цепочек на плоскости, исчезновением ВЗП и ростом зарядов меди $z > 1$ цепочек. По-видимому, данная перестройка зоны объясняет факт уширения зоны меди кристалла при $\delta = 1$ с повышением температуры, а также резкое уменьшение T_c в сверхстехиометрическом соединении с $\delta > 1$. Таким образом, расчеты подтвердили [13], что для широкой $d-p$ -

зоны кристалла, как в обычных металлах, ВЗП в p -подсистеме анионов O^{-k} ($k < 2$) не образуется.

Для получения структуры зоны плоскостей выполнены расчеты кривых $N(E)$ кристалла $YBa_2Cu_3O_7$ для различных значений I_{Cu} . В [11] определена величина эффективного потенциала отталкивания дырок d -зоны для меди, которая оценивается как 4.5 эВ. Эта величина близка к известному значению для меди (5 эВ). В наших расчетах для получения кривых $N(E)$ мы брали I_{Cu} в пределах 6.39 ÷ 6.26 эВ. Данная величина вполне сопоставима с оценками, полученными из расчетов других авторов, а также из экспериментальных исследований. Результаты рентгеноскопических и фотоэлектронных исследований [14] позволяют оценить величину $I_{Cu} \approx 6 \div 12$ эВ. Кластерные и зонные расчеты дают такие оценки [14]: $I_{Cu} \approx 6 \div 11$ эВ. Кривые $N(E)$ для $I_{Cu} = 6.39$; 6.34 и 6.26 эВ представлены на рисунке. Рассчитанные параметры плоскостей кластера кристалла $[Cu_{12}O_{18}]^{-12}$ методом CNDO даны в [4].



Плотность электронных состояний $N(E)$ CuO_2 – плоскостей кластера $[Cu_{12}O_{18}]^{-12}$: а) для $I_{Cu} = 6.39$ эВ, б) для $I_{Cu} = 6.34$ эВ и в) для $I_{Cu} = 6.26$ эВ

В [15] получена теоретическая локальная плотность состояний на плоскости атомов меди (см. также [11]). Можно отметить, что для $I_{Cu} = 6.26$ эВ форма кривой $N(E)$ близка к форме кривых, представленных в [11,15]. На рисунке (с) левый пик шириной менее 1 эВ соответствует d -состояниям ионов меди, правые три пика, удаленные от левого пика на 2 эВ, соответствуют гибридизированным $d-p$ -состояниям ионов О и Си, причем p -подзона, расположенная в области уровня Ферми, расщеплена на 2 пика. Из рисунка (с) следует, что d -подзона имеет ширину порядка 3 эВ, а ширина расщепленной p -подзоны составляет 0.8 эВ. При уменьшении параметра I_{Cu} от значения 6.39 эВ до 6.26 эВ происходит раздвижка d - и p -подзон. Таким образом, рассчитанная нами структура зоны плоскостей соответствует как экспериментальным, так и теоретическим расчетам других авторов.

Сравнивая результаты [4] и формы полученных кривых, можно сделать следующие выводы. В плоскостях при уменьшении параметра I_{Cu} от 6.39 эВ до 6.26 эВ происходит перетекание заряда между ионами Cu и O, отмеченное также в [5–10], увеличение параметра m от $m = 0.37$ до $m = 1.31$ с одновременным уменьшением щели кластера ΔE от 0.35 эВ до 0.1 эВ. При $I_{\text{Cu}} = 6.39$ эВ в плоскостях заряды ионов Cu и усредненные заряды анионов O имеют значения +1.66 и -1.17, соответственно. Для $I_{\text{Cu}} = 6.26$ эВ данные заряды равны +1.28 и -0.79. Уменьшение щели с увеличением параметра m связано с движением свободных d -состояний к уровню Ферми при уменьшении I_{Cu} [4]. При $I_{\text{Cu}} < 6.26$ эВ происходит увеличение параметра m до значения $m = 2$, уменьшение зарядов меди и ΔE до значения 0.02 эВ [4]. По-видимому, при высоких T возможен переход p -подсистемы в состояние с $m \sim 0$ и $\Delta E \sim 0$.

Из расчетов кластера следует [4], что для $I_{\text{Cu}} = 6.26$ эВ в плоскостях вблизи уровня Ферми имеется незначительное количество свободных $3d$ -состояний. Из этого следует, что $3d$ -электроны практически не участвуют в ковалентной связи. Расстояние между анионами O в плоскостях лежит в пределах $2.69 \sim 3.81$ Å. В этом случае p -подзона имеет незначительную ширину порядка 0.8 эВ из-за слабого перекрытия волновых функций анионов. В $3d$ -подсистеме из-за отсутствия условий ВЗП не возникает. При образовании ВЗП в p -подзоне образуется энергетическая щель, но наличие незначительного количества свободных d -состояний вблизи уровня Ферми обеспечивает металлическое состояние $d - p$ -зоны плоскостей [4].

Причиной образования ВЗП в p -подзоне шириной 0.8 эВ является выполнение условия (1). Одной из причин этого выполнения является уменьшение величины I_O при переходе от состояния O к O^{-k} . Из атомных расчетов следует, что у атома O энергия кулоновского взаимодействия двух p -электронов $I_O = 20.873$ эВ, у аниона $O^{-1} I_O = 17.982$ эВ и $I_O \sim 13.46$ эВ для аниона O^{-2} . Для грубой оценки энергии кулоновского взаимодействия двух электронов V_{AB} , расположенных на атомах A и B, применялась формула Оно [16], которая используется в квантовохимических расчетах методом CNDO:

$$V_{AB}(R_{AB}) = 14.3986 / (R_{AB}^2 + c^2)^{1/2} \text{ (эВ),} \quad (2)$$

где $c = 14.3986 / 2^{-1}(\mathbf{I}_A + \mathbf{I}_B)$, R_{AB} – межядерное расстояние между атомами A и B в Å. В плоскости CuO_2 анион O^{-1} имеет два соседних иона Cu на расстояниях $R_{\text{Cu}-\text{O}} = 1.89$ Å, четыре соседних аниона O^{-1} на расстояниях $R_{\text{O}-\text{O}} = 2.69$ Å и два соседних аниона O^{-1} на расстояниях $R_{\text{O}-\text{O}} = 3.81$ Å. Для иона меди I_{Cu} выбран равным 6.26 эВ. Расчеты дают следующие оценки параметра V : $V_{\text{CuO}}(1.89) = 6.45$ эВ, $V_{\text{OO}}(3.81) = 3.70$ эВ и $V_{\text{OO}}(2.69) = 5.13$ эВ. Формула (2) не учитывает пространственное расположение d - и p -электронных облаков. Учет распределения p -электронной плотности в пространстве должен привести к уменьшению $V_{\text{OO}}(2.69)$. Учитывая конкретное распределение p -электронной плотности плоскостей CuO_2 , можно положить $V_{\text{OO}}(2.69) \approx V_{\text{OO}}(3.81) \approx 3.70$ эВ.

В [17] показано, что переход из состояния с $m < 2$ в состояние с $m = 2$ в p -подсистеме плоскостей может происходить при незначительном смещении ионов Cu, причем данный переход сопровождается уменьшением щели кластера кристалла. Это позволяет предположить, что в образовании электронных пар в ВТСП могут принимать участие колебания атомов. Образованию локальных пар также способст-

вует незначительное различие параметров a и b элементарной ячейки кристалла и низкая степень вырождения орбиталей плоскостей.

По-видимому, нестабильность p -подсистемы способствует образованию СП состояния с высокой $T_c \sim n$ с относительно небольшой концентрацией n в ВТСП. В настоящее время экспериментальные исследования ВТСП указывают на то, что носителями являются локальные электронные пары, подчиняющиеся статистике Бозе–Эйнштейна [18,19]. Образование локальных пар происходит при $T^* > T_c$ и сопровождается возникновением псевдоцентри в электронном спектре. В [20] показано, что в плоско-квадратной решетке с параметром $m = 2$ энергия $E_1 = ZV - I$ совпадает с энергией образования электронной пары. Известно, что в металлах кулоновский потенциал описывается экранированным потенциалом: $\varphi = q \cdot \exp(-\lambda r)/r$. Тогда величины I , $V(R)$ необходимо умножить на $\exp(-\lambda r)$. Если взять концентрацию $n \sim 10^{21} \text{ см}^{-3}$ для металлических плоскостей CuO_2 ВТСП, то величина $1/\lambda \sim 1 \text{ \AA}$ [21]. Диаметр p -оболочки анионов O^{-1} и O^{-2} изменяется в пределах $2 \div 2.92 \text{ \AA}$. Для экранировки параметра I_0 можно взять промежуточное значение $R = 2.55 \text{ \AA}$. При наличии дырок $t < 1$ в d -оболочке и $t_1 < 1$ в p -оболочке имеем:

$$E_1 = t_1(t_1 6V_{\text{OO}}(3.81) \cdot \exp(-3.81\lambda) + 2tV_{\text{CuO}}(1.89) \cdot \exp(-1.89\lambda)) - I_0 \cdot \exp(-2.55\lambda). \quad (3)$$

По-видимому, состояние системы с $m < 2$ также будет способствовать образованию пар. В этом случае вклад электрон–электронного взаимодействия в энергию спаривания можно оценить величиной $E = E_1 m/2$. По всей вероятности, к этой энергии можно добавить вклад от участия электрон–фононного взаимодействия при образовании пар порядка $T_{ef} \sim 20 \text{ K}$.

В кристалле $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+\delta}$ с увеличением δ происходит рост t_1 и уменьшение t . Оценка температуры $T^* \sim E/k + T_{ef}$ при $t_1 = 0.83$, $t = 0.66$ и $m = 0.37$ [17] дает значение 25 K (параметры соответствуют кластеру с $I_{\text{Cu}} = 6.39 \text{ эВ}$ [17]), а для $t_1 = 0.91$, $t = 0.59$ и $m = 0.43$ температура $T^* \approx 145 \text{ K}$. При $I_{\text{Cu}} = 6.34 \text{ эВ}$ значение параметров $m = 0.54$, $t_1 = 0.99$ и $t = 0.50$ [17], при этом температура $T^* \approx 155 \text{ K}$. Для $t_1 = 1.0$, $t = 0.47$ и $m = 0.72$ температура $T^* \approx 35 \text{ K}$. Таким образом, получается колоколообразная зависимость $T^*(\delta)$, соответствующая экспериментальной зависимости $T_c(\delta)$.

-
1. S.P.Shubin and S.V.Vonsovskii, Proc. Roy. Soc. **145**, 159 (1934).
 2. R.Bary, Phys. Rev. **B3**, 2662 (1971).
 3. S.P.Ionov, I.I.Amelin, V.S.Lubimov et al., Phys. Stat. Sol. (b) **77**, 441 (1976).
 4. И.И.Амелин, ФНТ **22**, 539 (1996).
 5. В.И.Анисимов, В.Р.Галахов, В.А.Губанов и др., ФММ **65**, 204 (1987).
 6. R.E.Cohen, W.E.Pickett, H.Krakauer et al., Physica **B150**, 61 (1988).
 7. C.O.Rodriguez, A.I.Lichtenstein, I.I.Mazin et al., Phys. Rev. **B42**, 2692 (1990).
 8. T.Jarlborg, Solid State Comm., **71**, 663 (1989).
 9. G.S.Grader, P.K.Gakkagher, and A.T.Fiori, Phys. Rev. **B38**, 844 (1988).
 10. Е.Р.Лихачев, С.И.Курганский, О.И.Дубровский и др., ФТГ, **39**, 437 (1997).
 11. В.Г.Бабаев, В.В.Хвостов, П.В.Шибаев, Письма в ЖЭТФ **49**, 163 (1989).
 12. И.И.Амелин, СФХТ **5**, 1971 (1992).
 13. И.И.Амелин, СФХТ **5**, 802 (1992).
 14. Высокотемпературная сверхпроводимость (Актуальные проблемы), вып.2, под ред. А.А.Киселева; В.П.Лукин Электронная структура и магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводников, Л.: Изд-во ЛГУ, 1989, с.160.

15. W.M.Temmerman et al., *J. Phys.* **C21**, L867 (1988).
16. K.Ohno, *Adv. Quant. Chem.* **3**, 240 (1967).
17. И.И.Амелин, СФХТ **7**, 788 (1994).
18. Y.J.Uemura, *Physica* **C282–287**, 194 (1997).
19. Н.В.Аншукова, А.И.Головашкин, Л.И.Иванова и др., УФН **167**, 887 (1997).
20. В.И.Спицын, Г.В.Ионова, С.В.Вонсовский и др., *Электронная динамика и зарядовоупорядоченные кристаллы*, Черноголовка, 1985, с.121.
21. Ч.Киттель, *Введение в физику твердого тела*, М.: Наука, 1978, с.293.